

圖 3-1 流道方位 0°, △T_{sub} :28℃, Re:2000 之熱損失百分比圖



圖 3-2 流道方位 45°, △T_{sub}:28℃, Re:2000 之重複度實驗沸騰曲線圖



圖 3-3 流道方位 45°, △T_{sub} :28℃, Re:2000 之遲滯效應圖



圖 3-4 流道方位 45°之沸騰曲線圖與各階段之熱傳機制(1atm, ΔT_{sub} :28,

Re=2000)



圖 3-5 流道方位 45°, ΔT_{sub}:28℃, Re=2000 情況下之氣泡發展流譜圖



圖 3-6 流道方位 45°, ΔT_{sub} :28℃, Re=2000 情況下之氣泡發展流譜圖於沸騰曲線

之對應圖



圖 3-7 氣泡成長過程圖 (a)Heindel (b) Present Work (圖中黑色區塊為生成氣 泡)



圖 3-8 流道方位 45°, 次冷度:28℃(a), 21.5℃(b), 15℃(c)情況下, 不同 Re 之沸 騰曲線圖(Re 於單相熱傳區對於晶片壁溫之影響)



圖 3-9 流道方位 45°, 次冷度:28℃(a), 21.5℃(b), 15℃(c)情況下, 不同 Re 之沸 騰曲線圖(Re 對於 CHF 之影響)



圖 3-10 流道方位 45°, 次冷度:28℃(a), 21.5℃(b), 15℃(c)情況下, 不同 Re 之 熱傳係數圖



圖 3-11(a)流道方位 45°, 次冷度△T_{sub}: 28℃情況下,不同雷諾數之流譜圖



圖 3-11(b)流道方位 45°, 次冷度 ΔT_{sub} : 21.5℃情況下,不同雷諾數之流譜圖



圖 3-11(c)流道方位 45°, 次冷度 △T_{sub}:15℃情況下,不同雷諾數之流譜圖



圖 3-12 流道方位 45°, Re: 2000(a), 1200(b), 500(c)情況下,不同次冷度之沸騰 曲線圖(次冷度於單相熱傳區對於晶片壁溫之影響)



圖 3-13 流道方位 45°, Re:2000(a), 1200(b), 500(c)情況下,不同次冷度之沸騰 曲線圖(次冷度對於 CHF 之影響)



圖 3-14 流道方位 45°, Re:2000(a), 1200(b), 500(c)情況下,不同次冷度之熱傳 係數圖



圖 3-15(a)流道方位 45°, Re=2000 情況下,不同次冷度之流譜圖

















圖 3-19(a)流道方位於 0°, 45°, 90°, 次冷度 28℃, Re=2000 情況下之流譜圖



q"=363kW/㎡(99%CHF) q"=356kW/㎡(99%CHF) q"=346kW/㎡(99%CHF) 圖 3-19(b) 流道方位於 0°, 45°, 90°, 次冷度 28℃, Re=1200 情況下之流譜圖



圖 3-19(c) 流道方位於 0°, 45°, 90°, 次冷度 28℃, Re=500 情況下之流譜圖



圖 3-20 傾斜角度加熱銅片朝上與加熱銅片朝下於次冷度:28℃下, Re:2000(a),1200(b),500(c)之沸騰曲線圖





情況下之流譜圖



情況下之流譜圖



圖 3-22 各流道方位角度於不同次冷度(次冷度:28℃(a),21.5℃(b),15℃(c))情 況下和不同雷諾數之臨界熱通量比較圖





圖 3-24 流道方位 45°, 於 ΔT_{sub} : 28℃, 不同雷諾數之 CHF 與文獻 correlations



Tso:

$$q_{m}^{**} = \frac{q_{m}/(\rho_{g} U h_{fg})}{(\frac{\rho_{f}}{\rho_{g}})^{15/23} (\frac{L}{D_{h}})^{1/23} (1 + \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{7/23} (1 + 0.021 \frac{\rho_{f}}{\rho_{g}} \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{16/23}}$$
$$= 0.203 We^{-11/23}$$

(We:1~1000) McGillis:

$$q_{m}^{**} = \frac{q_{m}/(\rho_{g} Uh_{fg})}{(\frac{\rho_{f}}{\rho_{g}})^{15/23} (\frac{L}{D_{h}})^{1/23} (1 + \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{7/23} (1 + 0.021 \frac{\rho_{f}}{\rho_{g}} \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{16/23}}$$

= 0.321We^{-1/2}
(We<10) (We = $\frac{\rho_{f} U^{2} L}{\sigma}$)



CHF correlation for FC-72 in the inclined rectangular channel

(Re:500~2000)(ΔT _{sub} :15°C~28°C)

Correlations:

$$q_{m}^{**} = \frac{q_{m}/(\rho_{g} Uh_{fg})}{(\frac{\rho_{f}}{\rho_{g}})^{15/23} (\frac{L}{D_{h}})^{1/23} (1 + \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{7/23} (1 + 0.021 \frac{\rho_{f}}{\rho_{g}} \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{16/23}}$$
$$= 0.26 We^{-21/46}$$

$$(We = \frac{\rho_f U^2 L}{\sigma})$$





Correlation of h(w/m²°C)for FC-72 in the inclined rectangular channel

(Re:500~2000)(ΔT _{sub} :15°C~28°C)



圖 3-28 流道方位 0°, 45°, 90°和 45°, 135°兩組實驗之紐賽數(Nu)變化係數 (Coefficient of Variation)在不同雷諾數(Re)於臨界熱通量時之比較圖

44000

)

C. V. =
$$\frac{\sigma_{\psi, Ja}}{\mu_{\psi, Ja}} \times 100$$

($\sigma_{\psi, Ja} = \frac{\sqrt{\sum_{m=1}^{M} (Nu_{\psi, Ja, m} - \mu_{\psi, Ja})^2}}{M - 1}$

$$\left(\mu_{\psi,\mathrm{Ja}} = \frac{\sum_{\mathrm{m=1}}^{\mathrm{M}} \mathrm{Nu}_{\psi,\mathrm{Ja,m}}}{\mathrm{M}} \right)$$

第四章 結論與展望

4-1 結論

本論文以實驗方法,探討介電液 FC-72 於流道方位 0°、45°、90 °和 135°中,工作流體由下往上於截面積 10mm x 2mm,水利直徑 $D_h = 3.33$ mm 的狹窄矩形流道中,流經一塊模擬平滑加熱銅片,銅片表 面尺寸為 10mm x 10mm,在不同雷諾數(Re=2000、1200、500),和不 同次冷度($\Delta T_{sub} = 28^{\circ}C \cdot 21.5^{\circ}C \cdot 15^{\circ}C$),於一大氣壓狀態下進行流動 沸騰實驗,其實驗結果歸納如下:

- 在相同實驗條件下,不同工作日之沸騰曲線,於部份發展核沸騰區 因成核址發展的不同會有些許上下偏移的情形,而在單相熱傳區和 完全發展核沸騰區之沸騰曲線則一致,並將得到相同之臨界熱通 量。
- 此次流動沸騰實驗,氣泡於晶片表面發展為漸變模式,氣泡由下游
 中間開始產生,再逐漸發展終至佈滿整個銅片表面。
- 3. 在單相熱傳區相同次冷度下,增加流速可增加散熱能力,此外流速 越快,在加熱晶片表面所造成的擾動更大,有利於成核孔穴之活 化。故流速越高沸騰起始之加熱銅片表面過熱度越低。
- 4. 在高熱通量相同次冷度下,流速對於壁溫的影響逐漸減小,熱傳機 制由核沸騰主導,故不同流速之沸騰曲線在此區域逐漸逼近。流速

越快,臨界熱通量越高。當次冷度為28℃狀態下,雷諾數為500 時之臨界熱通量比雷諾數2000時之臨界熱通量降低12.4%。

- 五單相熱傳區相同流速下,次冷度對於加熱銅片表面過熱度有顯著
 的影響,平均降低次冷度1℃銅片表面溫度也約增高1℃。
- 6. 在高熱通量相同流速下,不同次冷度之沸騰曲線逐漸逼近,工作流 體之溫度對於壁過熱度的影響已降低。由於次冷度較低冷凝能力較 差,氣泡尺寸較大易聚合成膜,故次冷度越低臨界熱通量越低,臨 界熱通量產生時之加熱銅片表面過熱度也降低。當雷諾數(Re)為 2000 的情況下,次冷度為15℃之臨界熱通量比次冷度28℃時之臨 界熱通量降低27%。此外當雷諾數(Re)為2000 的情況下,次冷度 28℃時,臨界熱通量發生之銅片表面過熱度為45.7℃,而次冷度 15℃時,臨界熱通量發生之銅片表面過熱度為43.5℃,得知當次 冷度降低13℃,臨界熱通量發生時之銅片表面過熱度提前了2.2 ℃。
- 7. 流道方位於傾斜(45°)、水平(0°)、垂直(90°)中,相同實驗情況下, 沸騰曲線與流譜發展大致相同,接近臨界熱通量時,在垂直流道 中,浮力未能將氣泡於脫離晶片,故氣泡容易浮貼聚積於表面, 導致臨界熱通量較早產生。在相同實驗情況下,臨界熱通量之大 小,由大而小依序為:水平(0°)、傾斜(45°)、垂直(90°)。當次冷

度為28℃, 雷諾數為2000之狀態下, 垂直矩形流道之臨界熱通量 比水平之臨界熱通量降低3.2%; 相對於傾斜流道之臨界熱通量則 降低1.9%。

- 8. 在傾斜流道中,加熱銅片朝上(Face-up)(45°)與加熱銅片朝下 (Face-down)(135°)對於沸騰曲線影響甚巨。當銅片朝下時,浮力 會使氣泡貼於銅片表面,延緩脫離。導致散熱能力降低沸騰曲線偏 右,臨界熱通量亦提早產生。當次冷度為28℃,雷諾數為2000之 狀態下,加熱片朝下之臨界熱通量比加熱片朝上之臨界熱通量降低 18%。
- 9. 在四種流道方位角度中(0°, 45°, 90°, 135°),傾斜流道加熱銅片朝下(Face-down)(135°)之方位,散熱能力最差,臨界熱通量最低。 當次冷度為 28℃,雷諾數為 2000 之狀態下,流道方位 135°之臨界 熱通量比流道方位 0°之臨界熱通量降低 19%。
- 10. 本次實驗依據其實驗數據,與 Mudawar 和 Maddox[9]之經驗式,
 發展出傾斜流道(45°)中對應雷諾數(Re)範圍 500~2000,次冷度
 (ΔTsub)範圍 15℃~28℃之臨界熱通量預測經驗式:

$$q_{m}^{**} = \frac{q_{m}/(\rho_{g} U h_{fg})}{(\frac{\rho_{f}}{\rho_{g}})^{15/23} (\frac{L}{D_{h}})^{1/23} (1 + \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{7/23} (1 + 0.021 \frac{\rho_{f}}{\rho_{g}} \frac{c_{pf} \Delta T_{sub}}{h_{fg}})^{16/23}}$$
$$= 0.26 W e^{-21/46}$$

其中We =
$$\frac{\rho_{\rm f} U^2 L}{\sigma}$$
,其誤差範圍在15%以下。

11. 本次實驗依據其實驗數據,與Ke[23]之經驗式,發展出傾斜流道 (45°)中對應雷諾數(Re)範圍 500~2000,次冷度(△Tsub)範圍 15 ℃~28℃之熱傳經驗方程式: $Nu = \frac{h \cdot L}{k} = [950 \cdot Fr^{0.4} + 23 \cdot Boi^{0.4} \cdot Ja^{1.1}]$ 其中Fr = $\frac{G^2}{\rho_f^2 \cdot g \cdot D_h}$ > Boi = $\frac{q''}{G \cdot h_{f^{\alpha}}}$ > Ja = $\frac{\rho_f \cdot C_{pf} \cdot \Delta T_{sat}}{\rho_{\alpha} \cdot h_{f^{\alpha}}}$, 在中低流速(Re:1200~500)中,預測值與實驗值誤差在12%以內。 在高流速中(Re:2000)中,其誤差範圍在25%內。 12. 本實驗依據 Bower、Klausner[15]文獻中所定義之紐賽數(Nu)變 化係數(C.V.:Nusselt number coefficient of variation)來判 斷流道方位對於熱傳係數之影響,其結果發現,在主流液體由下 往上以及加熱銅片朝上之流道方位(0°,45°,90°)C.V.值極小,代 表改變此三種方位對於流動沸騰之熱傳能力影響很小。而在傾斜 流道中晶片朝上與朝下之流動方位(45°,135°)C. V. 值極大,代表 加熱銅片方位之改變對於流動沸騰之熱傳能力影響甚巨。

4-2 展望與建議

1. 本實驗針對主流液體由下往上流動以及加熱銅片朝上之較佳流道

方位進行流動沸騰實驗,未來可增加模擬加熱銅片個數或是加大尺 寸,並增加管道側面之流譜拍攝,在由下往上流動以及加熱片朝上 之流道方位條件下,進行多角度的流動沸騰實驗,找尋在不同晶片 個數、尺寸以及不同流道尺寸中最佳散熱能力之擺置方位,並發展 其經驗式。

- 可在流道中加入些許氣體,增加晶片表面之擾動能力,誘使氣泡 提早產生,探討在各種實驗情況下,氣體加入對於流動沸騰實驗之 影響。
- 3. 比較不同介電液或工作流體,於不同流道方位之流動沸騰實驗,探 討不同流體之性能以及對散熱能力之影響。

- [1] Mudawar, I., Maddox, D. E., 1989, "Critical Heat Flux in Subcooled Flow Boiling of Fluorocarbon Liquid on a Simulated Electronic Chip in a Vertical Rectangular Channel" Int. J. Heat Mass Transfer, pp. 379-394.
- [2] 3M , 2003, Fluorinert Electronic Liquid FC-72 product Information by 3M Center
- [3] Gersey, C. O., Mudawar, I., 1992, "Effect of Orientation on Critical Heat Flux From Chip Arrays During Flow Boiling" J. of Electronic Packaging, pp. 290-299.
- [4] Maddox, D. E., Mudawar, I., 1989, "Single-and Two-Phase Convective Heat Transfer From Smooth and Enhanced Microelectronic Heat Sources in a Rectangular Channel" J. of Heat Transfer, pp. 1045-1052.
- [5] 潘欽,2001, 沸騰熱傳與雙相流, 國立編譯館主編, PP.179
- [6] Del Valle M., V. H., Kenning, D. B. R., 1985, "Subcooled Flow Boiling at High Heat Flux" I.J. Heat Mass Transfer, pp. 1907-1920. graph from 潘欽, 2001, 沸腾熱傳與 雙相流

1896

- [7] Hino, R., Ueda T., 1985, "Studies on Heat Transfer and Flow Characteristics in Subcooled Flow Boiling-Partl, Boiling Characteristics. I. J" Multiphase, pp. 269-282.
- [8] Tso, C. P., Tou, K. W., Xu, G. P., 2000, "Flow Boiling Critical Heat of FC-72 from Flush-Mounted and Protruded Simulated Chip on a Vertical Rectangular Channel" I. J. of Multiphase Flow, pp. 351-365.
- [9] Levy, S., 1967, "Forced Convection Subcooled Boiling PredictionOf Vapor Volumetric Fraction" I.J. Heat Mass Transfer, pp. 951-965.

- [10] Hu, L. W., Pan, C., 1995, "Predictions of Void Fraction in Convective Subcooled Boiling Channels Using a One-Dimensional Two-fluid Model" J. of Heat Transfer, pp. 799-803.
- [11] Gersey, C. O., Mudawar, I., 1993, "Orientation Effects on Critical Effects on Critical Heat Flux From Discrete, In-Line Heat Sources in a Flow Chinnel" J. of Heat Transfer, pp. 973-985.
- [12] Zhang, H., Mudawar, I., Hasan, M. M., 2002, "Experimental Assessment of the Effects of Body Force, Surface Tension Force, and Inertia on Flow Boiling CHF" I.J. of Heat and Mass Transfer, pp. 4079-4095.
- [13] Zhang, H., Mudarwar, I., Hasan, M. M., 2002, "Experimental and Theoretical study of Orientation Effects on Flow Boiling CHF" I.J. of Heat and Mass Transfer, pp. 4463-4477.
- [14] Zhang, H., Mudawar, I., Hasan, M. M., 2004, "A Method for Assessing the Importance of Body Force on Flow Boiling CHF" J. of Heat Transfer, pp. 161–168.
- [15]Bower, J. Klausner, J., 2006, "Gravity Independent Subcooled Flow Boiling Heat Transfer Regime" Experimental Thermal and Fluid Science, pp. 141-149.
- [16] 許中彦,2005,"介電液FC-72在水平矩形狹窄流道內之流動沸 騰熱傳與氣泡特性之實驗研究." 國立交通大學機械工程學系 碩士論文, p. 30.
- [17] Mills, A. F., 2004, Heat Transfer second edition. Prentice Hall, p. 9
- [18] 蕭淵元,2006, "介電液 FC-72 在垂直矩形流道之流動沸騰實 驗研究." 國立交通大學機械工程學系碩士論文, p. 48.

- [19] Kline, S. J., 1985, "The Purpose of Uncertainty Analysis" J. Fluids Engineering, pp. 153–160.
- [20] Heindel, T. J., Ramadhyani, S., Incropera, F. P., 1992,
 "Liquid Immersion Cooling of a Longitudinal Array of Discrete Heat Sources in Protruding Substrates: II -Forced Convection Boiling " Journal of Electronic Packaging, pp. 63-70
- [21] McGillis, W. R., Carey, V. P., Strom, B. D., 1991, "Geometry Effects on Critical Heat Flux for Subcooled Convective Boiling From an Array of Heated Elements" J. of Heat Transfer, pp. 463-471.
- [22] Chang, J. Y., You, S. M., 1996, "Heater Orientation Effects on Pool Boiling of Micro-Porous-Enhanced Surfaces in Saturated FC-72" J. of Heat Transfer, pp. 937-943.
- [23] Ke, Jau-Han, Lin, Tsing-Fa, 2005, "Heat transfer and associated bubble characteristics for flow boiling of FC-72 on a heated micro-pin-finned silicon chip" 國立 交通大學機械工程學系碩士論文, pp. 85. -91.

附錄一 不準度分析

本論文實驗值之不準度分析乃參考S. J. Kline [19] 所建議的 不準度分析,方法如下:

設有一實驗值R 是由測量值x1、x2、x3……xn 所計算而來,而 這些測量值各有不準度為:

$$\frac{\delta x_1}{x_1} \cdot \frac{\delta x_2}{x_2} \dots \frac{\delta x_n}{x_n}$$

則R 的誤差量為:

所以R 的不準度可以寫成:

$$\frac{\delta R}{R} = \left[\left(\frac{\partial R/R}{\partial x_1/x_1}\frac{\delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial R/R}{\partial x_2/x_2}\frac{\delta x_2}{x_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R/R}{\partial x_n/x_n}\frac{\delta x_n}{x_n}\right)^2\right]^{1/2}$$
$$= \left[\left(\frac{\partial \ln R}{\partial \ln x_1}\frac{\delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln R}{\partial \ln x_2}\frac{\delta x_2}{x_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial \ln R}{\partial \ln x_n}\frac{\delta x_n}{x_n}\right)^2\right]^{1/2} \dots (a)$$

依照以上公式可以用來分析本實驗所須計算的總熱通量 $q_{total}^{"}$, 過熱度 ΔT , 及熱傳係數h。

例如:

總熱通量q" total 是由電流 I 與電壓 V 相乘而得

$$q''_{total} = IV$$

從公式(a) 可知不準度為:

$$\frac{\delta q_{total}^{"}}{q_{total}^{"}} = \sqrt{\left(\frac{\delta I}{I}\right)^{2} + \left(\frac{\delta V}{V}\right)^{2}}$$

本實驗的不準度分析附於表 2-2。

